

X線回折装置

キーワード: 構造解析

メーカー: パナリティカル

型式: X'Pert PRO MRD

測定項目: 原子配列などの物質の構造解析

主な仕様及び特長:

X線回折装置は、物質の構造(原子配列など)や品質の評価を行う装置です。様々な入射光学系(X線ミラー, X線レンズ, ソーラスリットなど), 受光光学系(Ge(220) 3回回折アナライザ結晶, 平行平板コリメーター等)を有しており, 逆格子空間マッピング, 極点図などの測定も可能です。



設置場所: 第一研究棟1階

担当者: 電気電子工学科 岡本保

連絡先: 0438-30-4100, okamto@e.kisarazu.ac.jp